

С 344. 1а

3-265

СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

2179/2-42

26/6.-42

13 - 6319



В.Н.Замрий, Ю.М.Останевич

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ТОКОВ

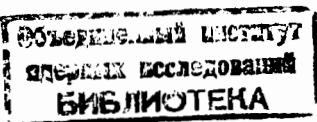
Лаборатория нейтронной физики

1972

13 - 6319

В.Н.Замрий, Ю.М.Останевич

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ТОКОВ



Прецизионное измерение малых токов (зарядов) является актуальной проблемой. Задача измерения токов в диапазоне до $10^{-10} - 10^{-9}$ а с точностью порядка 0,01 - 0,1% возникла при исследованиях критического состояния вещества. Для измерения малых токов широкое распространение получили методы интегрирования измеряемого тока, обеспечивающие точность порядка 1% ^{/1/}. В интеграторах тока с аналого-цифровым преобразованием точность может быть повышенена ^{/2,3/}, но область их применения ограничена сравнительно большими токами. Высокую точность измерения можно было бы достичь применением компенсационного метода с нуль-индикатором, однако, применение метода ограничено из-за трудностей создания стабильных генераторов регулируемого малого тока ^{/1/}. Существенным источником погрешности приборов, использующих эти методы, является нестабильность характеристик измерительного порогового устройства.

Описываемый метод измерений с нерегулируемым компенсационным током заданной величины позволяет существенно ослабить влияние нестабильности порогового напряжения, а также токов утечки. Сущность метода поясняют схема и временная диаграмма, приведенные на рисунке 1. Во время измерения ток ионизационной камеры i_x заряжает емкость C , а компенсирующий ток i_k большей величины заряжает эту емкость либо разряжает ее. Направление тока i_k изменяют, когда напряжение на емкости достигает порогового уровня $+U_n$ или $-U_n$. Таким образом, в течение некоторого времени T_1 происходит заряд емкости током $i_x + i_k$, а в течение времени T_2 - разряд током $i_k - i_x$. При достаточно боль-

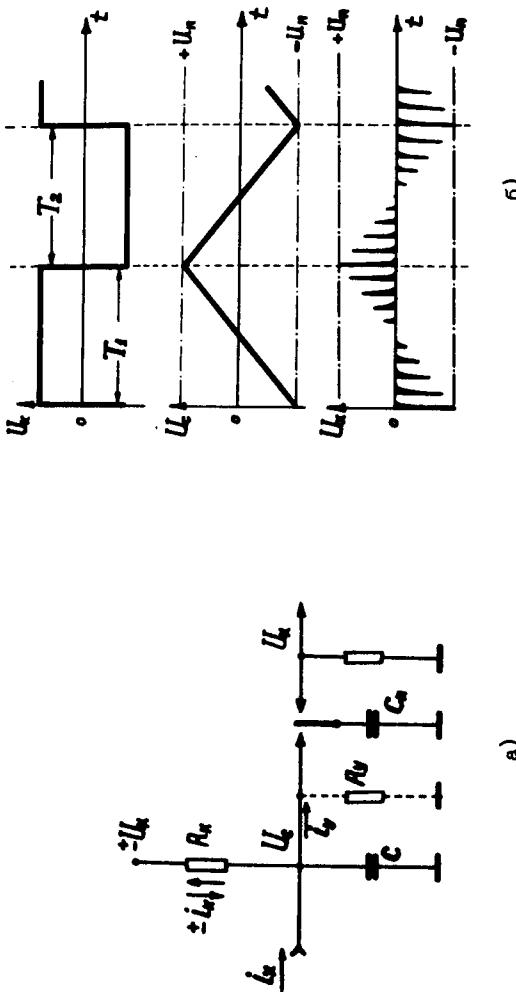


Рис. 1. Измерительная ячейка.
а) Принципиальная схема.
б) Временная диаграмма работы.

ших токах (когда токами утечки можно пренебречь) с известным приближением можно записать:

$$T_1 = C \frac{(+U_n) - (-U_n)}{i_x + i_k} = C \frac{2U_n}{i_k + i_x}, \quad T_2 = C \frac{(-U_n) - (+U_n)}{i_x - i_k} = C \frac{-2U_n}{i_k - i_x}. \quad (1)$$

Отсюда непосредственно можно найти:

$$i_x = i_k \frac{T_2 - T_1}{T_2 + T_1}. \quad (2)$$

В рассмотренном "идеальном" случае величина пороговых напряжений и емкости исключены из формулы, по которой определяется измеряемый ток. Отношение двух токов может быть определено с точностью измерения временных интервалов \$T_1\$ и \$T_2\$, которая может быть лучше требуемой точности прибора. Для абсолютных измерений тока \$i_x\$ необходимо иметь компенсационный ток известным с точностью, выше требуемой точности измерений.

Анализ работы устройства с учетом реальных характеристик позволяет оценить влияние токов утечки и возможного неравенства ("несимметрии") пороговых напряжений и компенсирующих токов и их нестабильности. Процессы перезаряда емкости \$C\$ обуславливаются действием тока ионизационной камеры \$i_x\$, компенсирующего тока, равного \$\frac{U_k - U_c}{R_k}\$, и токов утечки \$i = \frac{U_c}{R_y}\$, где \$U_c\$ – напряжение на емкости \$C\$, \$U_k\$ – напряжение источника тока \$i_k\$, \$R_y\$ – сопротивление, учитывающее токи утечки через изоляцию конденсатора и входную цепь измерительной схемы. Соответствующее дифференциальное уравнение

$$\frac{dU_c}{dt} = -\frac{U_c}{RC} + \frac{i_x + i_k}{C}, \quad (3)$$

где обозначено \$\frac{I}{R} = \frac{I}{R_k} + \frac{I}{R_y}\$ и \$i_k = \frac{U_k}{R_k}\$, имеет решение

$$U_c = U_n \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + (i_x + i_k) R (1 - e^{-\frac{t}{RC}}). \quad (4)$$

Решение (4) получено в предположении, что в начальный момент времени U_c равно одному из пороговых напряжений. Будем считать, что процесс заряда начинается при $U_c = U_n^-$ и заканчивается при $U_c = U_n^+$, а процесс разряда начинается при $U_c = U_n^+$ и заканчивается при $U_c = U_n^-$. Тогда выражение (4) для заряда и разряда имеет вид:

$$U_n^+ = U_n^- \cdot e^{-\frac{T_1}{RC}} + (i_x + i_k^+) R (1 - e^{-\frac{T_1}{RC}}), \quad (5a)$$

$$U_n^- = U_n^+ \cdot e^{-\frac{T_2}{RC}} + (i_x + i_k^-) R (1 - e^{-\frac{T_2}{RC}}), \quad (5b)$$

где использовано алгебраическое значение компенсирующего тока и порогового напряжения. Подставим значения $U_n^+ = U_n$, $U_n^- = -U_n(1+\epsilon)$ и $i_k^+ = i_k$, $i_k^- = -i_k(1+\delta)$, где коэффициенты ϵ и δ характеризуют относительное неравенство ("несимметрию") или относительную нестабильность соответствующих параметров устройства, затем делим уравнение (5a) на (5b), тем самым исключая величину U_n и основную зависимость от R , и находим отношение

$$i_x : i_k = [(1+\delta) \frac{1+(1+\epsilon)e^{-\frac{T_1}{RC}}}{1+\epsilon+e^{-\frac{T_2}{RC}}} - \frac{1-e^{-\frac{T_1}{RC}}}{1-e^{-\frac{T_2}{RC}}}] : [\frac{1+(1+\epsilon)e^{-\frac{T_1}{RC}}}{1+\epsilon+e^{-\frac{T_2}{RC}}} + \frac{1-e^{-\frac{T_1}{RC}}}{1-e^{-\frac{T_2}{RC}}}] . \quad (6)$$

Учитывая первые члены разложения экспоненты, получим:

$$\frac{i_x}{i_k} = \frac{T_2(1+\delta)-T_1}{T_2+T_1} - \frac{T_1 \cdot T_2}{RC(T_1+T_2)} \cdot \frac{\epsilon+\delta+\epsilon\delta}{\epsilon+2} . \quad (7)$$

Отсюда видно, что влияние неравенства или нестабильности пороговых напряжений, а также сопротивления $R = \frac{R_y \cdot R_k}{R_y + R_k}$ содержится во втором члене (7). Для оценки второго члена воспользуемся линейным приближе-

нием (1), тогда $T_1 = \frac{CU_n(2+\epsilon)}{i_k + i_x} \leq \frac{CU_n(2+\epsilon)}{i_k} = \frac{R_k CU_n(2+\epsilon)}{U_k}$, и учтем,

что всегда $\frac{T_2}{T_1 + T_2} < 1$. Поэтому

$$\frac{T_1 \cdot T_2}{RC(T_1 + T_2)} \cdot \frac{\epsilon + \delta + \epsilon \delta}{\epsilon + 2} < \frac{U_n}{U_k} \cdot \frac{R_k}{R} (\epsilon + \delta + \epsilon \delta). \quad (8)$$

Таким образом, видно, что влияние ϵ и R ослаблено в $\frac{n}{U_k}$ раз. Реально вносимая погрешность порядка 0,01% при $\frac{U_n}{U_k} < 10^{-3}$ и $\frac{R_k}{R} = 1 \pm 2$. Приведенные формулы позволяют оценить влияние нестабильности пороговых напряжений и сопротивления утечки, если величина ϵ характеризует относительную нестабильность пороговых напряжений, а в R включить диапазон возможных нестабильностей сопротивлений утечки R_y устройства. Влияние δ оказывается более существенным. Этот параметр в устройстве можно определить непосредственно при измерении величин T_1 и T_2 для случая $i_x = 0$, пренебрегая поправочным членом формулы (7). Таким же путем можно выполнить "симметрирование" токов i_k , т.е. приблизить δ к 0 при настройке "нуля" измерительного устройства. При определенных условиях выражение для определения токов (6), (7) может быть сведено к более простой формуле (2).

Отметим возможные разновидности рассматриваемого метода: 1) непосредственное однократное измерение T_1 и T_2 в одном цикле перезаряда (результат можно находить не только по разложению (7), но и из точного выражения (6)); 2) многократное повторение измерений с суммированием соответствующих времен:

$$\bar{i}_x = i_k \frac{\sum_{j=1}^n T_{2j} - \sum_{j=1}^n T_{1j}}{\sum_{j=1}^n T_{2j} + \sum_{j=1}^n T_{1j}}, \quad (9)$$

где i_x означает усредненный по n измерениям ток (суммирование необходимо для определения полного заряда или для определения среднего значения флюктуирующих токов при измерении за достаточно большое время); 3) измерение за каждый цикл перезарядки разности $T_2 - T_1$ и суммы $T_2 + T_1$ с последующим суммированием (или без него). Если при этом аппаратурно фиксировать сумму $\sum_{j=1}^n (T_2 + T_1)_j$, равную полной длительности измерений, то измерение тока сводится к измерению ему прямо пропорциональной величины $\sum_{j=1}^n (T_2 - T_1)_j$, которая допускает удобное аппаратурное

представление в цифровой форме. Последнее может быть реализовано, например, при помощи преобразования напряжения U_c в импульсы с пропорциональной амплитудой U_x (рис. 1), усиления и дискриминации их, и подсчета числа импульсов N_1 и N_2 , поступающих за время T_1 и T_2 , или разности чисел $N_2 - N_1$.

Результаты испытаний устройства подтвердили возможность применения описываемого метода для прецизионных измерений малых токов (зарядов).

Литература

1. В.С.Александров, В.А.Прянишников "Приборы для измерения малых напряжений и токов". Л., "Энергия", 1971.
2. В.М.Борзов, А.М.Илюкович "Измерительная техника", 1968, №2, 9.
3. E.J.Rogers. The Review of Scientific Instruments, V.34, No 6,660 (1963).

Рукопись поступила в издательский отдел
7 марта 1972 года.